IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:

Kazuhiro NOJIMA

Serial No.

Art Unit:

Filed:

Examiner:

For: Wavelength Converter And

Optical Cross Connect

System

: Atty Docket: 0121/0033

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENTS

Assistant Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Attached hereto please find certified copies of applicant's priority application as follows:

Japanese Patent Application No. 2002-187527 filed June 27, 200

Applicant requests the benefit of said June 27, 2002 filing dates for priority purposes pursuant to the provisions of 35 USC 119.

Respectfully submitted,

Louis Woo, Reg. No. 31,730 Law Offices of Louis Woo

717 North Fayette Street

Alexandria, Virginia 22314

Phone: (703) 299-4090

Date: \rightarrow 24, 2003

日本 国 特 許 庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application:

2002年 6月27日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-187527

[ST.10/C]:

[JP2002-187527]

出 願 人 Applicant(s):

松下電器産業株式会社

2003年 5月27日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office



特2002-187527

【書類名】 特許願

【整理番号】 2900740325

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G02F 1/365

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市港北区綱島東四丁目3番1号 松下通信

工業株式会社内

【氏名】 野嶋 一宏

【特許出願人】

【識別番号】 000005821

【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100093067

【弁理士】

【氏名又は名称】 二瓶 正敬

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 039103

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0003222

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 波長変換器及び光クロスコネクト装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 入力信号光の変換先波長である第1の波長の強度一定の光を出力する第1の半導体レーザと、

前記第1の半導体レーザの第1の波長の出力光を前記入力信号光によりその逆相に強度変調する第1の半導体光増幅器と、

前記入力信号光及び第1の半導体レーザの出力光と異なる第2の波長の強度一定の光を出力する第2の半導体レーザと、

前記第2の半導体レーザの第2の波長の出力光を前記入力信号光によりその逆相に強度変調する第2の半導体光増幅器と、

第2の半導体光増幅器の出力光から第2の波長の光を抽出する第1のフィルタと、

前記第1の半導体レーザの第1の波長の出力光を前記第1のフィルタにより抽出された第2の波長の光によりその逆相に強度変調する第3の半導体光増幅器と

前記第1、第3の半導体光増幅器の各出力光を合波する合波手段と、

前記合波手段により合波された光から第1の波長の光を抽出する第2のフィルタとを、

備えた波長変換器。

【請求項2】 前記第1、第3の半導体光増幅器の各出力光の光位相を調整する手段を更に備えた請求項1に記載の波長変換器。

【請求項3】 前記第1、第3の半導体光増幅器の各出力光の光強度を調整する手段を更に備えた請求項1又は2に記載の波長変換器。

【請求項4】 入力信号光の平均光電力をモニタして、前記第1、第3の半導体光増幅器の各出力光の光強度を調整するよう構成された請求項3に記載の波長変換器。

【請求項5】 前記第1の半導体光増幅器の光出力における第1の波長成分から光信号中の下底強度レベルをモニタして、前記第1、第3の半導体光増幅器の

各出力光の光強度を調整するよう構成された請求項3に記載の波長変換器。

【請求項6】 前記第2のフィルタにより抽出された第1の波長成分から光信 号中の下底強度レベルをモニタして、前記第1、第3の半導体光増幅器の各出力 光の光強度を調整するよう構成された請求項3に記載の波長変換器。

【請求項7】 前記第1、第2もしくは第3の半導体光増幅器のいずれか1つもしくは複数に対して、出力光レベルを調整するための強度一定の光信号を印加する第3の半導体レーザを更に備えた請求項1又は2に記載の波長変換器。

【請求項8】 入力信号光の平均光電力をモニタして、前記第3の半導体レーザの光出力レベルを制御するよう構成された請求項7に記載の波長変換器。

【請求項9】 前記第1の半導体光増幅器の光出力における第1の波長成分から光信号中の下底強度レベルをモニタして、前記第3の半導体レーザの光出力レベルを制御するよう構成された請求項7に記載の波長変換器。

【請求項10】 前記第2のフィルタにより抽出された第1の波長成分から光信号中の下底強度レベルをモニタして、前記第3の半導体レーザの光出力レベルを制御するよう構成された請求項7に記載の波長変換器。

【請求項11】 請求項1から10のいずれか1つに記載の波長変換器の要素の一部又は全部が半導体基板上に集積化されている波長変換器。

【請求項12】 前記第1の半導体レーザが波長可変型レーザである請求項1 から11のいずれか1つに記載の波長変換器。

【請求項13】 波長多重された複数の波長の光信号からそれぞれの波長に分離する波長分離型光フィルタと、

請求項12に記載の波長変換器であって、前記波長分離型光フィルタにより分離された光信号それぞれを入力とする複数の波長変換器と、

前記複数の波長変換器から出力された各信号を合波する光合波器とを、

有する光クロスコネクト装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、入力された光信号を別波長の光信号に変換し出力する波長変換器及

び光クロスコネクト装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

波長変換器として、半導体光増幅器の利得抑圧現象を利用したものが知られている。図12は従来の波長変換器の構成を示し、半導体レーザ101は波長λsの入力信号光の変換先波長λpの強度一定のプローブ光を出力する。そして、波長λsの入力信号光と半導体レーザ101の出力する出力一定で波長λpのプローブ光とを光合波器102に入力して信号光とプローブ光とを合波し、波長λs+λpの合波光を半導体光増幅器103に出力する。半導体光増幅器103では信号光の強度が大きい場合は利得が小さくなり、信号光の強度が小さい場合は利得が大きくなる(利得の非線型性)。この利得の変化により波長λpのプローブ光が強度変調され、実質的に波長λsの信号光が波長λpに変換されたのと等価となる。そして、これを光バンドパスフィルタ104を通し、波長λpの信号光を抽出することで波長変換を実現している。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、図12に示す構成の波長変換器では、波長2pに変換された光信号の消光比が減少するという問題がある。図13に図12の構成での光波形を示す。図13(a)に示す半導体レーザ101の強度一定のプローブ光と図13(b)に示す信号光とを合波し、半導体光増幅器103に入力すると、その出力は図13(c)のようになり、波長2pのプローブ光が入力信号光と逆相で変調される。図13(c)の信号から光バンドパスフィルタ104で波長2pのみの光信号を抽出すると図13(d)のような波形となる。ここで、図13(d)に示すようにハイレベルの光電力PpとローレベルのPnの比を示す消光比が、図13(b)に示す入力信号よりも小さくなっている。この消光比の減少によって光受信時の感度劣化を生じさせる要因となる。

[0004]

本発明はこの波長変換時の消光比減少を抑えることができ、光受信時の感度劣化を抑えることができる波長変換器を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】

請求項1に記載の発明の波長変換器は、上記目的を達成するために、

入力信号光の変換先波長である第1の波長の強度一定の光を出力する第1の半 導体レーザと、

前記第1の半導体レーザの第1の波長の出力光を前記入力信号光によりその逆相に強度変調する第1の半導体光増幅器と、

前記入力信号光及び第1の半導体レーザの出力光と異なる第2の波長の強度一定の光を出力する第2の半導体レーザと、

前記第2の半導体レーザの第2の波長の出力光を前記入力信号光によりその逆相に強度変調する第2の半導体光増幅器と、

第2の半導体光増幅器の出力光から第2の波長の光を抽出する第1のフィルタと、

前記第1の半導体レーザの第1の波長の出力光を前記第1のフィルタにより抽出された第2の波長の光によりその逆相に強度変調する第3の半導体光増幅器と

前記第1、第3の半導体光増幅器の各出力光を合波する合波手段と、

前記合波手段により合波された光から第1の波長の光を抽出する第2のフィルタとを、

備えた構成とした。

上記構成により、第1の半導体光増幅器が出力する第1の波長の光信号に対して、位相が反転した第2の波長の光信号を生成し、マッハツェンダ型干渉計を構成するので、第1の半導体光増幅器が出力する第1の波長のローレベルを、位相が反転した第2の波長の光信号のハイレベルで打ち消すことによって消光比の劣化を抑えることができる。

[0006]

請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の波長変換器において、前記第1、 第3の半導体光増幅器の各出力光の光位相を調整する手段を更に備えたことを特 徴とする。 請求項3に記載の発明は、請求項1又は2に記載の波長変換器において、前記第1、第3の半導体光増幅器の各出力光の光強度を調整する手段を更に備えたことを特徴とする。

[0007]

請求項4に記載の発明は、請求項3に記載の波長変換器において、入力信号光の平均光電力をモニタして、前記第1、第3の半導体光増幅器の各出力光の光強度を調整することを特徴とする。

請求項5に記載の発明は、請求項3に記載の波長変換器において、前記第1の 半導体光増幅器の光出力における第1の波長成分から光信号中の下底強度レベル をモニタして、前記第1、第3の半導体光増幅器の各出力光の光強度を調整する ことを特徴とする。

請求項6に記載の発明は、請求項3に記載の波長変換器において、前記第2のフィルタにより抽出された第1の波長成分から光信号中の下底強度レベルをモニタして、前記第1、第3の半導体光増幅器の各出力光の光強度を調整することを特徴とする。

[0008]

請求項7に記載の発明は、請求項1又は2に記載の波長変換器において、前記第1、第2もしくは第3の半導体光増幅器のいずれか1つもしくは複数に対して、出力光レベルを調整するための強度一定の光信号を印加する第3の半導体レーザを更に備えたことを特徴とする。

請求項8に記載の発明は、請求項7に記載の波長変換器において、入力信号光 の平均光電力をモニタして、前記第3の半導体レーザの光出力レベルを制御する ことを特徴とする。

請求項9に記載の発明は、請求項7に記載の波長変換器において、前記第1の 半導体光増幅器の光出力における第1の波長成分から光信号中の下底強度レベル をモニタして、前記第3の半導体レーザの光出力レベルを制御することを特徴と する。

請求項10に記載の発明は、請求項7に記載の波長変換器において、前記第2 のフィルタにより抽出された第1の波長成分から光信号中の下底強度レベルをモ ニタして、前記第3の半導体レーザの光出力レベルを制御することを特徴とする

[0009]

請求項11に記載の発明は、請求項1から10のいずれか1つに記載の波長変 換器の前記構成要素の一部又は全部が半導体基板上に集積化されていることを特 徴とする。

請求項12に記載の発明は、請求項1から11のいずれか1つに記載の波長変換器において、前記第1の半導体レーザが波長可変型レーザであることを特徴とする。

請求項13に記載の発明の光クロスコネクト装置は、

波長多重された複数の波長の光信号からそれぞれの波長に分離する波長分離型 光フィルタと、

請求項12に記載の波長変換器であって、前記波長分離型光フィルタにより分離された光信号それぞれを入力とする複数の波長変換器と、

前記複数の波長変換器から出力された各信号を合波する光合波器とを、

有する構成とした。

[0010]

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。

(第1の実施の形態)

図1は、本発明の第1の実施の形態の構成例を示し、各構成要素は半導体基板上に集積化されている。半導体レーザ2は入力信号光の変換先波長 λ p 1の強度一定のプローブ光を出力し、この波長 λ p 1のプローブ光は光分岐器 3、光合波器 4 を通って半導体光増幅器 5 に入力される。また、波長 λ s の入力信号光も光分岐器 1 と光合波器 4 を通って半導体光増幅器 5 に入力され、波長 λ p 1のプローブ光が入力信号光によりその逆相で強度変調される。

[0011]

半導体レーザ 6 は入力信号光の波長 λ s 、半導体レーザ 2 の波長 λ p 1 と異なる波長 λ p 2 の強度一定のプローブ光を出力し、この波長 λ p 2 のプローブ光は

光合波器7を通って半導体光増幅器8に入力される。また、波長2sの入力信号 光も光分岐器1と光合波器7を通って半導体光増幅器8にも入力され、波長2p 2のプローブ光が入力信号光によりその逆相で強度変調される。半導体光増幅器 8の光出力から光バンドパスフィルタ9で波長2p2の光信号のみを抽出して光 合波器10に入力し、また、半導体レーザ2の波長2p1のプローブ光を光分岐 器3を介して光合波器10に入力し、波長2p1、2p2を合波する。

[0012]

この波長 λ p 1、 λ p 2の合波光を半導体光増幅器 1 1 に入力して、波長 λ p 1のプローブ光が波長 λ p 2の光信号と逆相で強度変調される。半導体光増幅器 5 の出力と半導体光増幅器 1 1 の出力は光合波器 1 2 で合波され、光バンドパスフィルタ 1 3 で λ p 1 の波長の信号のみが出力される。

[0013]

上記構成での波長変換の原理を図2、図3に示す光波形を元に説明する。図2 (a)に示す波長 λ p 1 のプローブ光と図2 (b)に示す波長 λ s の信号光入力とを半導体光増幅器5に入力すると、図2 (c)に示すように波長 λ p 1 のプローブ光の光強度が波長 λ s の逆相で変調される。同様に半導体光増幅器8でも波長 λ p 2 のプローブ光が強度変調され、この波長 λ p 2 の強度変調信号を光バンドパスフィルタ9 で抽出すると、図3 (d)に示すように消光比の減少した波形となる。図3 (d)に示す波長 λ p 2 の光信号と波長 λ p 1 のプローブ光を光合波器10により合波して半導体光増幅器11に入力すると、その出力は図3 (e)に示すように波長 λ p 1 のプローブ光が波長 λ p 2 の光信号と逆相の強度変調した信号となる。

[0014]

そこで、光合波器12で波長 λ p 1 をもつ図3 (f)に示すような逆相の2つの信号を合波した場合、マッハツェンダ型干渉計が構成され、その2つの光信号の光領域での位相が λ / 2 ずれている場合、光信号が打ち消し合う。その際、図3 (f)の上下の波形で光電力が近い時間は光が極小となり、光電力が大きく異なる場合は光の打消しは小さい。そのため、図3 (g)に示すように、消光比の大きい波長 λ p 1 の光信号を出力する。

[0015]

上記のように本発明の波長変換器では、出力する波長 λ p 1 の光信号に対し位相が反転した波長 λ p 2 の光信号を生成し、マッハツェンダ型干渉計を構成することで消光比の劣化を抑えた波長変換器を実現している。

[0016]

(第2の実施の形態)

図4に本発明の第2の実施の形態の構成を示す。第2の実施の形態の波長変換器は、第1の実施の形態の波長変換器において、半導体光増幅器11と光合波器12の間に光位相可変器14を挿入している。光分岐器3から半導体光増幅器5を通り光合波器12を通るパスと半導体光増幅器11を通るパスとの位相差を光位相可変器14によって調整し、光領域での位相差をλ/2に近づけることで消光比をさらに改善できる。

[0017]

(第3の実施の形態)

図5に本発明の第3の実施の形態の構成を示す。第3の実施の形態の波長変換器は、第1の実施の形態の波長変換器において、半導体光増幅器11と光合波器12の間に可変光強度減衰器15を挿入している。可変光強度減衰器15によって光分岐器3から半導体光増幅器5を通り光合波器12を通るパスと半導体光増幅器11を通るパスとの光強度差を調整し、消光比をさらに改善できる。

[0018]

(第4の実施の形態)

図6に本発明の第4の実施の形態の構成を示す。第4の実施の形態の波長変換器は、第3の実施の形態の波長変換器において、光分岐器1と光合波器4の間に光分岐器18を挿入し、さらに光分岐器18からの光信号を電気信号に変換する光/電気変換器16と、その光/電気変換器16の出力電圧をモニタして可変光強度減衰器15の減衰率を制御する制御回路17が追加されている。上記のような構成で、波長2sの入力信号光の平均光電力をモニタし、可変光強度減衰器15を制御することで、入力信号光の光レベルが変化しても自動で第3の実施例に示すような消光比の改善が行える。

[0019]

(第5の実施の形態)

図7に本発明の第5の実施の形態の構成を示す。第5の実施の形態の波長変換器は、第3の実施の形態の波長変換器において、半導体光増幅器5と光合波器12の間に光分岐器19を挿入し、さらに光分岐器19からの光信号のうち波長λp1の光信号を光バンドパスフィルタ20で抽出する。光バンドパスフィルタ20を通過した光信号を光/電気変換器16で電気信号に変換し、ピーク検出回路21で光/電気変換器16の出力電気信号の下底レベルを検出する。ピーク検出回路21の出力するレベル(つまり半導体光増幅器5の出力する光信号のうち波長λp1の光信号のローレベル)が半導体光増幅器11の出力する光信号のうちの波長λp1の光信号のハイレベルとが同一となるように可変光強度減衰器15を調整することで、入力信号光の光レベルが変化しても自動で第3の実施例に示すような消光比の改善が行える。

[0020]

(第6の実施の形態)

図8に本発明の第6の実施の形態の構成を示す。第6の実施の形態の波長変換器は、第5の実施の形態の波長変換器において、光分岐器19と光バンドパスフィルタ20の代わりに、光バンドパスフィルタ13の後段に光分岐器22を追加し、光分岐器22の出力の一方を光/電気変換器16に入力するようにしたものである。

[0021]

ここで、ピーク検出回路21で本装置出力である波長 λ p 1 の光信号のローレベルをモニタし、そのレベルが最小となるように可変光強度減衰器 1 5 の減衰率を制御することで入力信号光の光レベルが変化しても自動で第 3 の実施例に示すような消光比の改善が行える。

[0022]

(第7の実施の形態)

図9に本発明の第7の実施の形態の構成を示す。第7の実施の形態の波長変換器は、第1の実施の形態の波長変換器において、光合波器10と半導体光増幅器

11との間に光合波器24を挿入し、さらに光合波器24に波長λp1、λp2 とは異なる波長λp3の強度一定の光信号を出力する半導体レーザ23で構成している。

[0023]

ここで、半導体レーザ23の光出力レベルによって半導体光増幅器11の出力する波長 λ p 1の光信号の強度が変化し、半導体レーザ23から半導体光増幅器11に入力される光信号が大きくなると、半導体光増幅器11の出力する波長 λ p 1の光信号は小さくなる。この現象を利用し、光分岐器3から半導体光増幅器5を通り光合波器12を通るパスと半導体光増幅器11を通るパスとの光強度差を調整し、消光比をさらに改善できる。また、入力信号光の平均光電力をモニタしたり、半導体光増幅器5又は光バンドフィルタ13の光出力における波長 λ p 1から光信号中の下底強度レベルをモニタして、半導体レーザ23の光出力レベルを制御することにより、消光比をさらに改善できる。

[0024]

(第8の実施の形態)

図10に本発明の第8の実施の形態の構成を示す。第8の実施の形態の波長変換器は、第1の実施の形態に示した波長変換器において、半導体レーザ2を波長可変レーザ30に変更したものである。この変更によって、本波長変換器の出力波長λp1を適宜変更することが可能な波長変換器を実現できる。

[0025]

(第9の実施の形態)

図11に本発明の第9の実施の形態の構成を示す。第9の実施の形態の光クロスコネクト装置は、入力される波長多重光信号の波長分離を行う波長分離型光フィルタ25と、波長分離型光フィルタ25で分離した各波長 λ s(1)~ λ s(N)の光信号毎に波長変換を行う第9の実施の形態に記載のN個の波長変換器26と、N個の波長変換器26の出力するN個の光信号を合波する光合波器27とで構成されている。

[0026]

波長変換器26は第9の実施の形態に示したように、出力する波長を変化させ

る構成であり、入力される波長多重された光信号のそれぞれの波長を変換して再び波長多重する光クロスコネクト装置を実現できる。

[0027]

【発明の効果】

以上説明したように本発明によれば、第1の半導体光増幅器が出力する第1の 波長の光信号に対して、位相が反転した第2の波長の光信号を生成し、マッハツ ェンダ型干渉計を構成するので、第1の半導体光増幅器が出力する第1の波長の ローレベルを、位相が反転した第2の波長の光信号のハイレベルで打ち消すこと によって消光比の劣化を抑えることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第1の実施の形態として波長変換器を示す構成図

【図2】

本発明の波長変換原理を示す説明図

- (a) プローブ光出力波形
- (b) 信号光波形
- (c) 半導体光增幅器 5 出力波形

【図3】

本発明の波長変換原理を示す説明図

- (d) 光バンドパスフィルタ9出力波形
- (e) 半導体光増幅器 1 1 出力波形
- (f) 光合波器12入力波形
- (g) 光バンドパスフィルタ13出力波形

【図4】

本発明の第2の実施の形態として波長変換器を示す構成図

【図5】

本発明の第3の実施の形態として波長変換器を示す構成図

【図6】

本発明の第4の実施の形態として波長変換器を示す構成図

【図7】

本発明の第5の実施の形態として波長変換器を示す構成図 【図8】

本発明の第6の実施の形態として波長変換器を示す構成図 【図9】

本発明の第7の実施の形態として波長変換器を示す構成図 【図10】

本発明の第8の実施の形態として波長変換器を示す構成図 【図11】

本発明の第9の実施の形態として光クロスコネクト装置を示す構成図 【図12】

従来の波長変換器の構成図

【図13】

従来の波長変換原理を示す説明図

- (a) 半導体レーザ101出力波形
- (b) 信号光波形
- (c) 半導体光増幅器103出力波形
- (d) 光バンドパスフィルタ104出力波形

【符号の説明】

- 1、3、18、19、22 光分岐器
- 2、6、23 半導体レーザ
- 4、7、10、12、24、27 光合波器
- 5、8、11 半導体光増幅器
- 9、13、20 光バンドパスフィルタ
- 14 光位相可変器
- 15 可変光強度減衰器
- 16 光/電気変換器
- 17 制御回路
- 21 ピーク検出回路

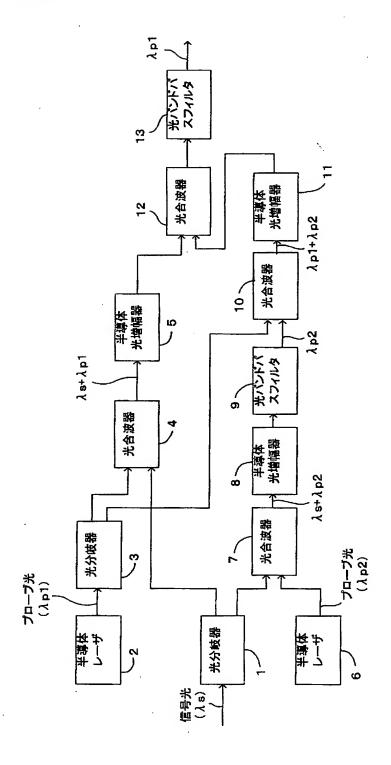
特2002-187527

- 25 波長分離型光フィルタ
- 26 波長変換器
- 30 波長可変レーザ

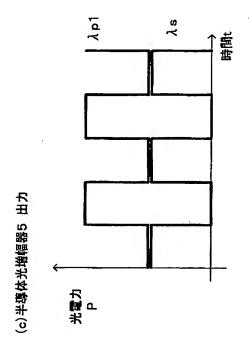
【書類名】

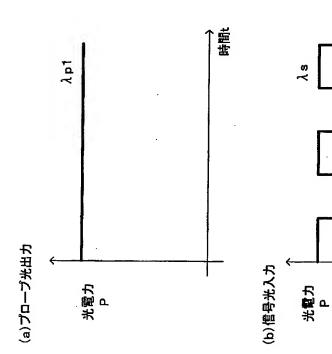
図面

【図1】

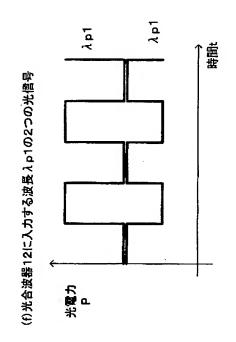


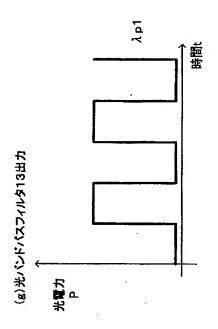
【図2】

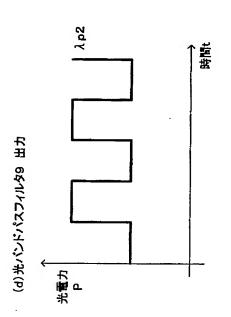


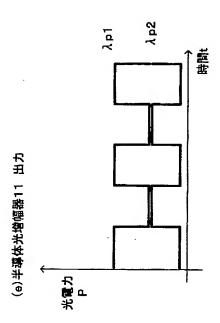


【図3】

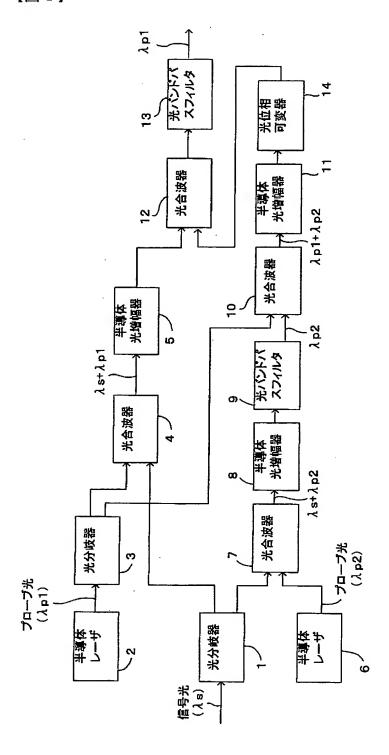




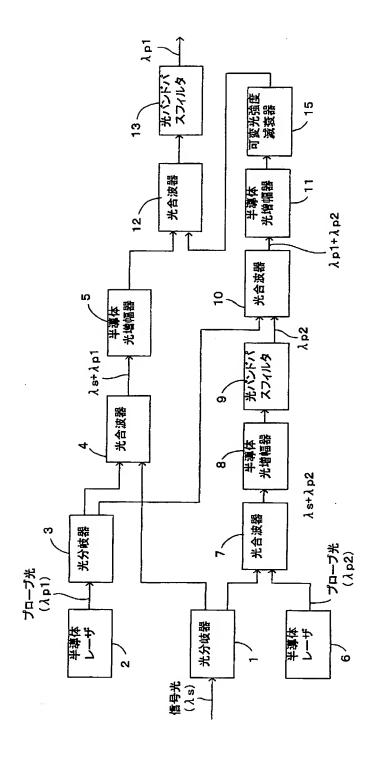




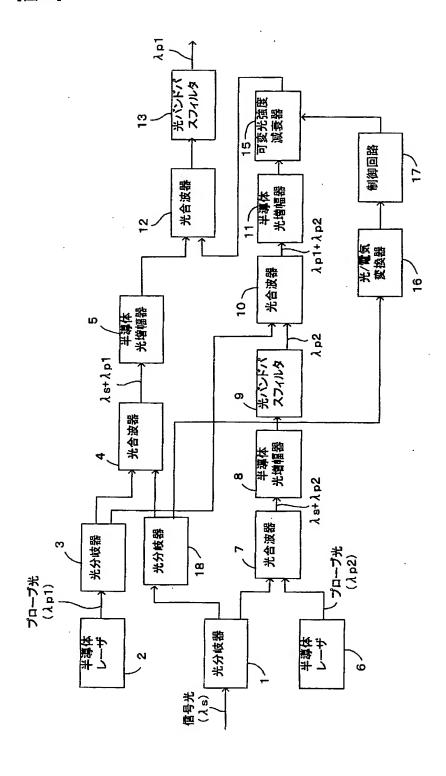
【図4】



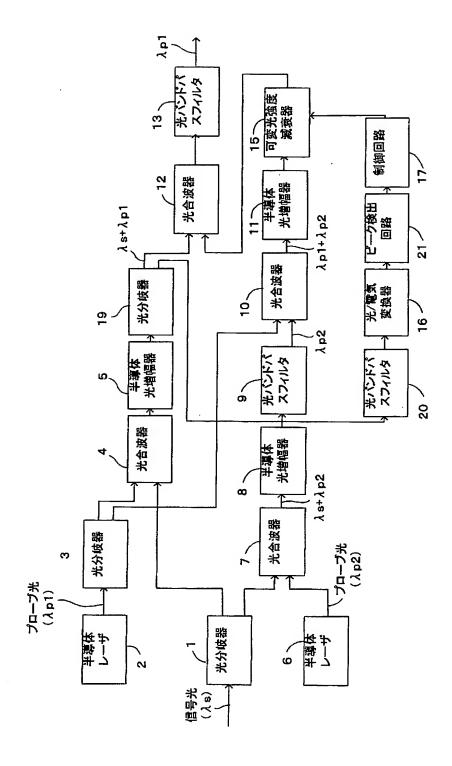
【図5】



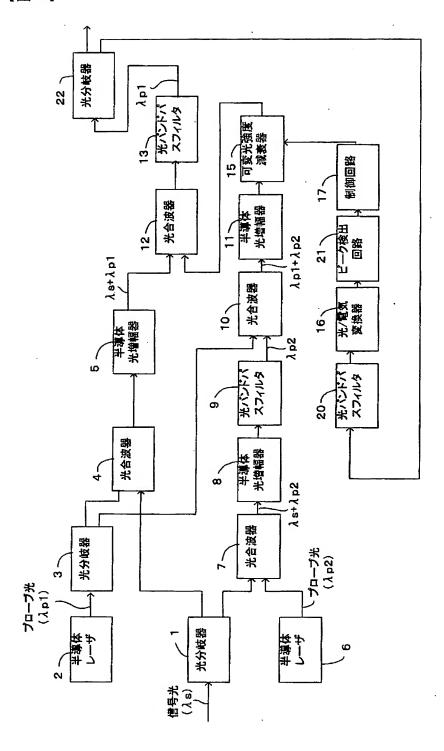
[図6]



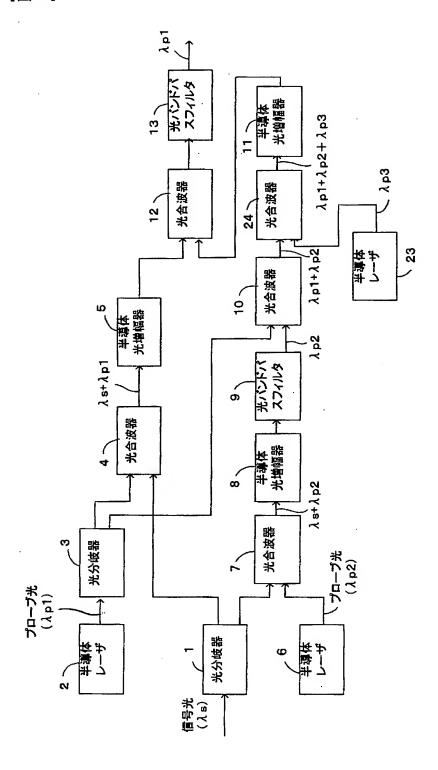
【図7】



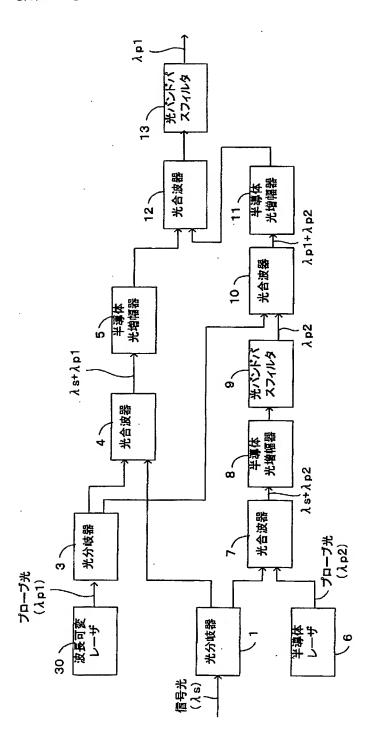
【図8】



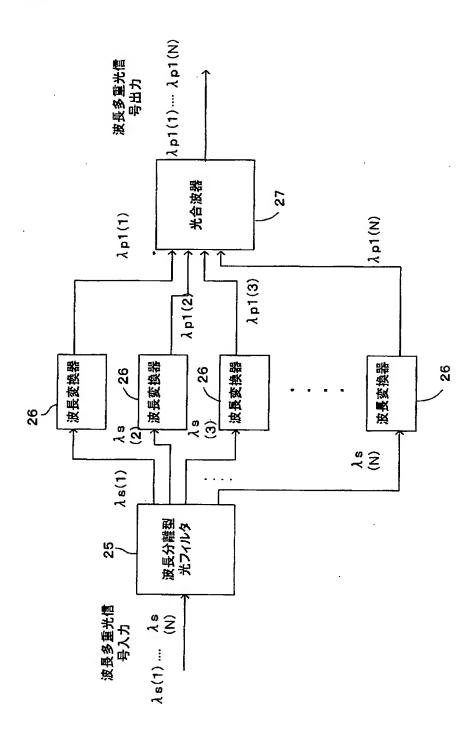
【図9】



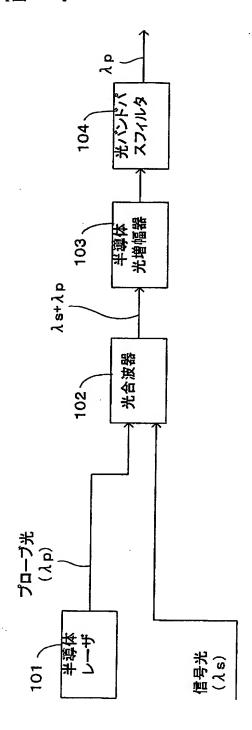
【図10】



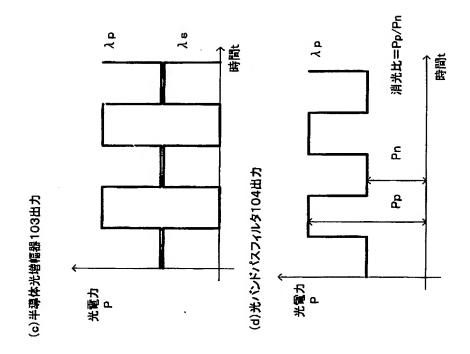
【図11】

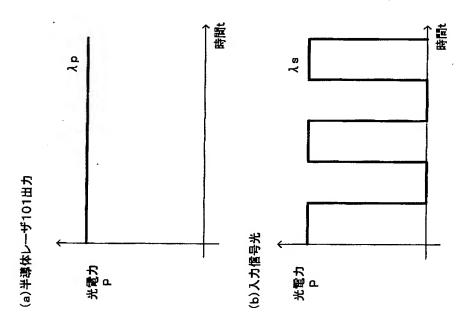


【図12】



【図13】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 半導体光増幅器の利得の非線型性を用いた波長変換器において、消光 比劣化を改善する。

【解決手段】 半導体光増幅器 5 が出力する波長 λ p 1 の光信号に対して、位相が反転した波長 λ p 2 の光信号を生成し、マッハツェンダ型干渉計を構成することで、半導体光増幅器 5 が出力する波長 λ p 1 の光信号のローレベルを、位相が反転した波長 λ p 2 の光信号のハイレベルで打ち消すことによって消光比の劣化を抑える。

【選択図】 図1

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2002-187527

受付番号 50200942021

書類名特許願

担当官 第二担当上席 0091

作成日 平成14年 6月28日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成14年 6月27日

出願人履歴情報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府門真市大字門真1006番地

氏 名

松下電器産業株式会社